МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ**

Микросхемотехника

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Радиотехнических устройств

Учебный план z11.03.01_25_00.plx

11.03.01 Радиотехника

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс		3	4	4		ого
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	VIT	010
Лекции	2	2	2	2	4	4
Лабораторные			4	4	4	4
Иная контактная работа			0,25	0,25	0,25	0,25
Итого ауд.	2	2	6,25	6,25	8,25	8,25
Контактная работа	2	2	6,25	6,25	8,25	8,25
Сам. работа	34	34	88	88	122	122
Часы на контроль			3,75	3,75	3,75	3,75
Контрольная работа заочники			10	10	10	10
Итого	36	36	108	108	144	144

Программу составил(и):

Старший преподаватель, Степашкин В.А.

Рабочая программа дисциплины

Микросхемотехника

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

 Φ ГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 931)

составлена на основании учебного плана:

11.03.01 Радиотехника

утвержденного учёным советом вуза от 28.02.2025 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Радиотехнических устройств

Протокол от 29.05.2025 г. № 9 Срок действия программы: 20252029 уч.г. Зав. кафедрой Паршин Юрий Николаевич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Радиотехнических устройств Протокол от _____2026 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Радиотехнических устройств Протокол от __ _____2027 г. № ___ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры Радиотехнических устройств Протокол от ____ 2028 г. № ___ Зав. кафедрой _____ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

Радиотехнических устройств

Протокол от	2029 г. №	-
Зав. кафедрой		

2020 10

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучение студентами принципов построения интегральных схем, схемотехнических решений (электрических и структурных схем), используемых в интегральных микросхемах и радиоэлектронной аппаратуре на их основе, а также применения интегральных микросхем в различных микроэлектронных аналоговых устройствах. При изучении этой дисциплины закладываются основы знаний, позволяющих умело использовать современную элементную базу радиоэлектроники и понимать тенденции и перспективы ее развития и практического использования; приобретаются навыки расчета и экспериментального исследования различных функциональных каскадов на основе аналоговых интегральных микросхем

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
Ц	(икл (раздел) ОП:	B 1.0							
2.1	Требования к предварі	ительной подготовке обучающегося:							
2.1.1	Основы теории цепей								
2.1.2	Физика								
2.1.3	Ознакомительная практі	нка							
2.1.4	Учебная практика								
2.1.5	Физика (факультатив)								
2.2	Дисциплины (модули) предшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как							
2.2.1	Основы теории радиона:	вигационных систем и комплексов							
2.2.2	Производственная практ	ика							
2.2.3	Радиоматериалы и ради	окомпоненты							
2.2.4	Основы теории радиолог	кационных систем и комплексов							
2.2.5	Выполнение и защита в	ыпускной квалификационной работы							
2.2.6	Преддипломная практик	a							

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

ОПК-1.1. Использует фундаментальные законы природы и основные физические и математические законы в процессе исследования физических объектов и процессов

Знать

основы схемотехники, элементную базу аналоговых устройств, их принцип работы, характеристики, модели и способы их количественного описания при использовании в радиотехнических цепях и устройствах

Уметь

использовать полученную информацию для решения практических задач

Владеть

основными навыками экспериментального исследования характеристик устройств на аналоговых микросхемах, работы с приборами; анализа и обработки данных экспериментов

ОПК-1.2. Применяет математический аппарат для анализа свойств и поведения физических объектов

Знать

основы схемотехники, элементную базу аналоговых устройств, их принцип работы, характеристики, модели и способы их количественного описания при использовании в радиотехнических цепях и устройствах

Уметь

использовать полученную информацию для решения практических задач

Владеть

владеть методами, необходимыми для выбора элементной базы с учетом требований надежности, устойчивости к воздействию окружающей среды, ЭМС и технологичности

ОПК-1.3. Составляет математические модели физических объектов и процессов для решения задач инженерной деятельности

Знать

основы схемотехники, элементную базу аналоговых устройств, их принцип работы, характеристики, модели и способы их количественного описания при использовании в радиотехнических цепях и устройствах

Уметь

использовать полученную информацию для решения практических задач

Владеть

владеть методами, необходимыми для выбора элементной базы с учетом требований надежности, устойчивости к воздействию окружающей среды, ЭМС и технологичности

3.1	Знать:
3.1.1	основы схемотехники, элементную базу аналоговых устройств, их принцип работы, характеристики, модели и способы их количественного описания при использовании в радиотехнических цепях и устройствах
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать полученную информацию для решения практических задач
3.3	Владеть:
3.3.1	владеть методами, необходимыми для выбора элементной базы с учетом требований надежности, устойчивости к воздействию окружающей среды, ЭМС и технологичности, а также основными навыками экспериментального исследования характеристик устройств на аналоговых микросхемах, работы с приборами; анализа и обработки данных экспериментов

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАІ	ние дисц	иплин	Ы (МОДУЛЯ	1)	
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Введение. Основные схемотехнические направления построения аналоговых интегральных схем					
1.1	Основные понятия и определения /Тема/	3	0			
1.2	Определение микросхемотехники. Общая характеристика интегральной электроники как технического и научного направления. Интеграция и миниатюризация — основные принципы микросхемотехники. Теоретические и практические ограничения интеграции и миниатюризации. Определение и понятие интегральной схемы (ИС), классификация ИС, основные компоненты ИС и их основные функции, степени компонентной интеграции и уровни схемотехнического построения ИС. /Лек/	3	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э2	
1.3	Определение микросхемотехники. Общая характеристика интегральной электроники как технического и научного направления. Интеграция и миниатюризация — основные принципы микросхемотехники. Теоретические и практические ограничения интеграции и миниатюризации. Определение и понятие интегральной схемы (ИС), классификация ИС, основные компоненты ИС и их основные функции, степени компонентной интеграции и уровни схемотехнического построения ИС /Ср/	3	3	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э2	
1.4	Основные свойства компонентов интегральных микросхем. Основные принципы архитектурного построения современных линейных интегральных схем /Тема/	3	0			
1.5	Отличия дискретных и интегральных элементов. Достоинства и недостатки интегральных компонентов. Основные принципы проектирования ИМС: принципы, позволяющие получить стабильность работы схем: принципы отношения, симметрии, малых номиналов, равных потенциалов, активности. /Лек/	3	0,5	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	

	+					
1.6	Отличия дискретных и интегральных элементов. Достоинства и недостатки интегральных компонентов. Основные принципы проектирования ИМС: принципы, позволяющие получить стабильность работы схем: принципы отношения, симметрии, малых номиналов, равных потенциалов, активности. /Ср/	3	3	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
	Раздел 2. Дифференциальный каскад (ДК) как основная схема каскада для интегральной схемы					
2.1	Основная (классическая) схема дифференциального каскада /Тема/	3	0			
2.2	Основные свойства идеального и реального ДК. Причины, определяющие широкое применение дифференциального каскада (ДК) в полупроводниковой микросхемотехнике. Основные характеристики ДК. Проходная характеристика ДК и ее свойства. Основные свойства схем на основе ДК и их сравнение со схемой ОЭ /Лек/	3	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
2.3	Основные свойства идеального и реального ДК. Причины, определяющие широкое применение дифференциального каскада (ДК) в полупроводниковой микросхемотехнике. Основные характеристики ДК. Проходная характеристика ДК и ее свойства. Основные свойства схем на основе ДК и их сравнение со схемой ОЭ /Ср/	3	3	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
2.4	Дифференциальный каскад с активной (динамической) нагрузкой /Тема/	3	0			
2.5	Особенности работы дифференциального каскада (ДК) в микрорежиме. Применение в ДК активной (динамической) нагрузки. Основные характеристики ДК с активной нагрузкой. Схемные решения ДК с активной нагрузкой. /Лек/	3	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
2.6	Особенности работы дифференциального каскада (ДК) в микрорежиме. Применение в ДК активной (динамической) нагрузки. Основные характеристики ДК с активной нагрузкой. Схемные решения ДК с активной нагрузкой. /Ср/	3	3	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
2.7	Шумовые свойства и параметры дифференциального каскада /Teмa/	3	0			
2.8	Определение шумов. Эквивалентная схема реально-го шумящего четырехполюсника. Коэффициент шума. Условие согласования по минимуму коэффициента шума. Шумовая мощность ДК. Спектры НЧ и ВЧ шумов. /Ср/	3	4	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
2.9	Способы подачи сигнала на дифференциальный каскад /Тема/	3	0			

2.10	I a		1 0 0 7	0777447		l .
2.10	Симметричный и несимметричный методы: схемы, достоинства и недостатки. Эквивалентная схема. Требования к ГСТ при использовании несимметричного метода /Лек/	3	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
2.11	Симметричный и несимметричный методы: схемы, достоинства и недостатки. Эквивалентная схема. Требования к ГСТ при использовании несимметричного метода /Ср/	3	3	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
	Раздел 3. Основные схемы базовых и вспомогательных каскадов аналоговых интегральных схем					
3.1	Входные каскады интегральных схем /Тема/	4	0			
3.2	Основные требования. Базовая схема — дифференциальный усилитель (каскад): типовая схема, ДК с динамической нагрузкой, ДК с перевернутой нагрузкой, способы повышения входного сопротивления ДК (схемотехника). Реализация ДК в промышленных схемах /Лек/	4	0,5	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
3.3	Основные требования. Базовая схема — дифференциальный усилитель (каскад): типовая схема, ДК с динамической нагрузкой, ДК с перевернутой нагрузкой, способы повышения входного сопротивления ДК (схемотехника). Реализация ДК в промышленных схемах /Ср/	4	4	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
3.4	Выходные каскады интегральных схем /Тема/	4	0			
3.5	Основные требования. Базовая и практическая схемы. Выходной каскад на транзисторах разного типа проводимости. Схемы защиты промышленных усилителей. Их свойства, характеристики, параметры. /Лек/	4	0,5	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
3.6	Основные требования. Базовая и практическая схемы. Выходной каскад на транзисторах разного типа проводимости. Схемы защиты промышленных усилителей. Их свойства, характеристики, параметры. /Ср/	4	4	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
3.7	Источники тока (генераторы стабильного тока (ГСТ)) /Тема/	4	0			

3.8	Определения ГСТ. Две основные схемы ГСТ. Задачи при выборе схемы ГСТ. Способы, позволяющие получить аппроксимацию, близкую к идеальному источнику тока. Основная схема построения ГСТ — токовое зеркало и ее свойства. Схемотехника ГСТ на биполярных и полевых транзисторах, основные свойства, достоинства и недостатки схем. /Лек/	4	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
3.9	Определения ГСТ. Две основные схемы ГСТ. Задачи при выборе схемы ГСТ. Способы, позволяющие получить аппроксимацию, близкую к идеальному источнику тока. Основная схема построения ГСТ — токовое зеркало и ее свойства. Схемотехника ГСТ на биполярных и полевых транзисторах, основные свойства, достоинства и недостатки схем. /Ср/	4	4	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
3.10	Источники напряжения /Тема/	4	0			
3.11	Определение источника напряжения. Основные требования, предъявляемые к ним. Схемотехника источников напряжения и источников опорного напряжения, основные свойства, достоинства и недостатки схем. /Лек/	4	0,5	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
3.12	Определение источника напряжения. Основные требования, предъявляемые к ним. Схемотехника источников напряжения и источников опорного напряжения, основные свойства, достоинства и недостатки схем. /Ср/	4	5	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
3.13	Схемы сдвига уровня постоянного напряжения /Teмa/	4	0			
3.14	Необходимость применения схем сдвига уровня в ИС. Основная задача, решаемая с помощью трансляторов уровня. Схемотехника трансляторов уровня, основные свойства, достоинства и недостатки схем /Лек/	4	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
3.15	Необходимость применения схем сдвига уровня в ИС. Основная задача, решаемая с помощью трансляторов уровня. Схемотехника трансляторов уровня, основные свойства, достоинства и недостатки схем /Ср/	4	4	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.6Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
	Раздел 4. Схемотехника операционных усилителей					
4.1	Общие характеристики операционных усилителей /Teмa/	3	0			

	1-		1	1		1
4.2	Определение и условные обозначения операционных усилителей (ОУ). Структурные и упрощенные схемы стандартных ОУ. Схема включения. Условие баланса ОУ /Лек/	3	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
4.3	Определение и условные обозначения операционных усилителей (ОУ). Структурные и упрощенные схемы стандартных ОУ. Схема включения. Условие баланса ОУ /Ср/	3	3	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
4.4	Основные свойства операционных усилителей /Тема/	3	0			
4.5	Свойства идеального ОУ. Два правила анализа схем включения ОУ. Свойства реального ОУ. /Лек/	3	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
4.6	Свойства идеального ОУ. Два правила анализа схем включения ОУ. Свойства реального ОУ. /Ср/	3	3	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
4.7	Основные параметры операционных усилителей /Тема/	3	0			
4.8	Коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления, напряжение смещения нуля и его температурный дрейф, коэффициент влияния источника питания, входной ток и его температурный дрейф, разность входных токов и их температурный дрейф, частота единичного усиления, скорость нарастания выходного напряжения, время восстановления. /Ср/	3	4	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
4.9	Работа операционного усилителя с обратной связью /Тема/	3	0			
4.10	Основные математические выражения. Амплитудно-частотная характеристика ОУ. Частотная коррекция ОУ. /Ср/	3	5	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.4 Э1 Э2	
	Раздел 5. Аналоговые устройства на основе операционных усилителей					
5.1	Линейные и нелинейные схемы на базе операционных усилителей и методы их расчета /Тема/	4	0			

5.2	Инвертирующий и неинвертирующий	4	16	ОПК-1.1-3	Л1.1	
	усилители. Точный повторитель напряжения. Масштабирующий усилитель. Особенности схем включения ОУ от однополярного источника напряжения питания. Суммирующий усилитель. Неинвертирующий сумматор. Усилитель разности. Усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Преобразователи "ток-напряжение" и "напряжение-ток". Аналоговый вольтметр постоянного тока. Усилитель с регулируемым сдвигом фазы. Компаратор. Логарифмический усилитель. /Ср/			ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-З ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-З ОПК-1.3-У	Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	
5.3	Исследование неинвертирующих усилителей на операционном усилителе /Лаб/	4	2	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	
5.4	Активные фильтры на базе операционных усилителей /Teмa/	4	0			
5.5	Параметры, характеристики, назначение фильтров. Преимущества и недостатки активных фильтров. Активные фильтры нижних и верхних частот, полосовые и режекторные фильтры. Методика расчета активных фильтров. Выбор элементов схемы на ОУ, обеспечивающие заданную точность обработки сигналов /Ср/	4	16	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.3 Э1 Э2	
5.6	Исследование активных фильтров нижних и верхних частот на операционном усилителе /Лаб/	4	2	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
	Раздел 6. Микросхемы СВЧ диапазона					
6.1	Общие положения /Тема/	4	0			
6.2	Твердотельная электроника СВЧ. Арсенид галлия — основной материал монолитных микроволновых ИС. Тонкопленочные и толстопленочные гибридные ИС. Монолитные ИС. Проблема воспроизводимости и повторяемости результатов. /Ср/	4	5	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.2 Л3.3 Э1 Э2	
6.3	Элементная база электроники СВЧ /Тема/	4	0			
6.4	Пассивные и активные элементы, Линии межсоединений. Микрополосковые линии. Пассивные СВЧ элементы – резисторы, конденсаторы, индуктивности. Диоды СВЧ диапазона. Интегральные СВЧ транзисторы: полевые транзисторы с барьером Шоттки и другие типы транзисторов СВЧ диапазона /Ср/	4	7	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.2 Э1 Э2	

6.5	Монолитные интегральные микросхемы /Тема/	4	0			
6.6	Транзисторные структуры для монолитных ИС /Ср/	4	5	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6Л3.2 Э1 Э2	
	Раздел 7. Проблемы повышения степени интеграции. Основы функциональной электроники. Микросистемная техника и наноэлектроника					
7.1	Проблемы повышения степени интеграции /Тема/	4	0			
7.2	Барьеры на пути перехода от микро- к наноэлектронике. Особенности наноэлектронных приборов. Новые транзисторные структуры: полевые транзисторы, транзисторы с резонансным туннелированием. Квантовые приборы наноэлектроники. Одноэлектронные приборы. Новые материалы наноэлектроники. /Ср/	4	6	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.5 Л2.6Л3.2 Э1 Э2	
7.3	Основы функциональной электроники /Тема/	4	0			
7.4	Возможности функциональной электроники. Элементы акустоэлектроники. Функциональная полупроводниковая электроника. Приборы функциональной электроники 2-го поколения. /Ср/	4	6	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.5 Л2.6Л3.2 Э1 Э2	
7.5	Микросистемная техника и наноэлектроника /Тема/	4	0			
7.6	Основные направления. Умная пыль, умная поверхность, умная структура. ВЧ микросистемы. /Ср/	4	6	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У	Л1.1 Л1.2Л2.5 Л2.6Л3.2 Э1 Э2	
	Раздел 8. Иная контактная работа. Контрольная работа. Часы на контроль					
8.1	Иная контактная работа /Тема/	4	0			
8.2	Консультирование в течение семестра /ИКР/	4	0,25	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2	
8.3	Часы на контроль /Тема/	4	0			

8.4	Зачет /Зачёт/	4	3,75	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2	
				ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В		
8.5	Контрольная работа /Тема/	4	0	OTHE 1.3 B		
8.6	Контрольная работа "Расчет активных фильтров и их основных характеристик" /КрЗ/	4	10	ОПК-1.1-3 ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В ОПК-1.3-3 ОПК-1.3-У ОПК-1.3-В	Л1.1 Л1.2Л2.3Л3. 2 Л3.3 Э1 Э2	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные

материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Микросхемотехника»

		6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература					
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л1.1	Кожухов, В. В.	Электронные цепи и микросхемотехника. Импульсные и цифровые устройства. Конспект лекций: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирски й государственн ый технический университет, 2021, 166 с.	978-5-7782- 4557-0, https://www.i prbookshop.r u/126611.htm	
Л1.2	Игнатов А.Н., Полянская А.В.	Микросхемотехника. : Учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственн ый университет телекоммуник аций и информатики, 2021, 460 с	https://www.i prbookshop.r u/138769.htm	
		6.1.2. Дополнительная литература		•	
Nº	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л2.1	Ульрих Титце, Кристоф Шенк, Карабашев Г. С.	Полупроводниковая схемотехника. Т.І	Саратов: Профобразова ние, 2019, 826 с.	978-5-4488- 0052-8, http://www.ip rbookshop.ru/ 88003.html	

	1	1				
№	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л2.2	Ульрих Титце, Кристоф Шенк, Карабашев Г. С.	Полупроводни	иковая схемотехника. Т.II	Саратов: Профобразова ние, 2019, 940 с.	978-5-4488- 0059-7, http://www.ip rbookshop.ru/ 88004.html	
Л2.3	Алексенко А.Г., Шагурин И.И.	Микросхемото	Микросхемотехника: Учеб.пособие для вузов		5-256-00693- 2, 1	
Л2.4	Степаненко И.П.			М.:Лаборатор ия Базовых Знаний, 2003, 488c.	5-93208-045- 0, 1	
Л2.5	Игнатов А.Н.	Микросхемоте	ехника и наноэлектроника : учеб. пособие	СПб.: Лань, 2011, 528c.	978-5-8114- 1161-0, 1	
Л2.6	Щука А.А.	Электроника:	учеб.	СПб.: БХВ- Петербург, 2008, 739с.	978-5-9775- 0160-6, 1	
			6.1.3. Методические разработки			
No	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л3.1	Степашкин В.А., Озеран С.П.	Линейные усилители и активные фильтры : Методические указания		Рязань: РИЦ РГРТУ, 2014,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/977	
Л3.2	Степашкин В.А.	Микросхемотехника: Методические указания		Рязань: РИЦ РГРТУ, 2020,	https://elib.rsr eu.ru/ebs/dow nload/2410	
Л3.3	Степашкин В.А.	Микросхемотехника: метод. указ. к контр. работе		Рязань, 2020, 64c.	, 1	
Л3.4	Степашкин В.А.	Микросхемотехника: метод. указ. к контр. работе		Рязань, 2020, 64c.	, 1	
	6.2. Переч	ень ресурсов и	нформационно-телекоммуникационной сети	"Интернет"	I	
Э1	Микросхемотехника					
Э2	Микросхемотехника					
	•		ого обеспечения и информационных справоч ободно распространяемого программного обе отечественного производства		исле	
Наименование			Описание			
			Свободное ПО			
adobe PDFReader Micro-Cap 12			Свободное ПО			
	AB Classroom, Simulink	Classroom	Коммерческая лицензия			
THE TENTO CIGOSTOOM, DIMUMIK CIGOSTOOM			политор точких лицополя			

WinDjView	Свободное ПО		
FoxitReader	Свободное ПО		
MS Office 2003	Комерческая лицензия		
Mozilla	Свободно распространяемое программное обеспечение под лицензиями		
Операционная система Windows XP/Vista/7/8/10	Microsoft Imagine: Номер подписки 700102019, бессрочно		
Mathcad University Classroom	Бессрочно. Лицензия на ПО РКG-7517-LN, SON – 2469998, SCN – 8A1365510		
Kaspersky Endpoint Security	Коммерческая лицензия		
6.3.2 Перечень информационных справочных систем			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
1	412 лабораторный корпус. учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, для проведения лабораторных работ Учебно-лабораторные стенды по электронике и микросхемотехнике со сменными панелями; Генераторы сигналов GRG-450B – 8 шт; ГЗ-112 – 8 шт; Милливольметр двухканальный GVT-427B – 8 шт; Мультиметр М-838 – 8 шт; Частотомеры ЧЗ-34A – 4 шт, ЧЗ-35A – 4 шт; Вольтметр универсальный В7-26 -1 шт				
2	413 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся, лекционная аудитория Специализированная мебель (70 посадочных мест), магнитно-маркерная доска, экран. Мультимедийный проектор (NEC) ПК: Intel Core 2 duo /2Gb – 1 шт Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ				
3	415 лабораторный корпус. Помещение для самостоятельной работы Специализированная мебель (56 посадочных мест), магнитно-маркерная доска, экран. Мультимедийный проектор (NEC) ПК: Intel Pentium /8Gb – 1 шт Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ				

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Методические указания дисциплины «Микросхемотехника»).

	——————————————————————————————————————					
ДОКУМЕНТ ПОДПИ	ОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ					
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Паршин Юрий Николаевич, Заведующий кафедрой РТУ	14.11.25 16:03 (MSK)	Простая подпись			
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Кошелев Виталий Иванович, Заведующий кафедрой РТС	17.11.25 10:16 (MSK)	Простая подпись			